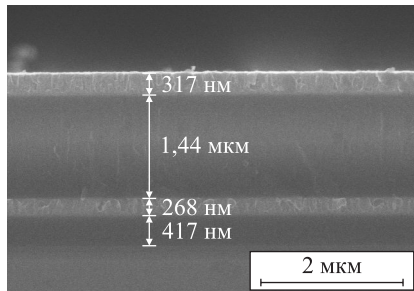
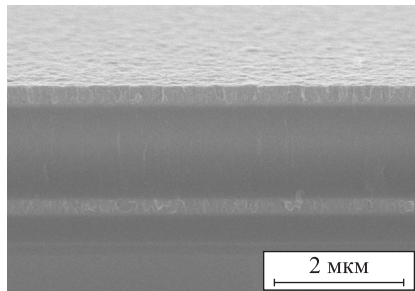


*a/a**б/б*

*Рис. 4.* Изображение среза тестовой МДП-структуры, исследованной методом растровой электронной микроскопии под разными углами (*а, б*)

*Fig. 4.* Cross-section images of a test MIS structure examined by scanning electron microscopy at different angles (*a, b*)